



ZEISS プレゼンテーション スケジュール

Seeing beyond

6/9 (月)	講演会 A Bio XRM 15:00 ~ 15:15	ワークショップ XRM 17:30 ~ 18:00
6/10 (火)	講演会 B 9:45 ~ 10:15	ランチョンセミナー SEM & FIB-SEM 12:00 ~ 12:50
写真コンクール 9:00 ~ 17:30 (2F ロビー)		
6/11 (水)	講演会 C FIB-SEM 15:45 ~ 16:00	講演会 D FIB-SEM 16:00 ~ 16:15
写真コンクール 10:00 ~ 17:30 (2F ロビー)		

(敬称略)

9 (月)	講演会 A Bio XRM	1C_AB-2_03 15:00 ~ 15:15 C会場 (5F 502/503)	「落下時にボダイジュ (<i>Tilia miqueliana</i>) の種が回転するために重要な構造について」 前田 将輝 (拓殖大)、井阪 琢真 (カールツァイス株式会社)
	ワークショップ XRM	OT-4 17:30 ~ 18:00 C会場 (5F 502/503)	「高分解能汎用 CT ZEISS VersaXRM: 半自動ワークフローによる非破壊微細構造イメージング」 佐藤 朗、山本 千智 (カールツァイス株式会社)
10 (火)	講演会 B	2A_IMB-1_06 9:45 ~ 10:15 A会場 (3F メインホール)	「各種顕微鏡オペレーションと画像データ解析におけるネットワーク応用の可能性」 佐藤 朗 (カールツァイス株式会社)
	ランチョン セミナー SEM&FIB-SEM	LS-7 12:00 ~ 12:50 B会場 (5F 501) 当日8:00~引換券配布 (1F)	「ZEISS 電子顕微鏡: FE-SEM と FIB-SEM による先駆的な研究革新 ~ユーザーフレンドリーな高性能電子顕微鏡で 3D 視点から材料を理解する~」 佐藤 朗、小幡 卓真、孫 カイイン (カールツァイス株式会社)
11 (水)	講演会 C FIB-SEM	3D_IMB-2_24 15:45 ~ 16:00 D会場 (4F 411/412)	「走査イオン顕微鏡による Nd-Fe-B 焼結磁石の磁区コントラスト観察」 名越 正泰、佐藤 馨 (JFE テクノリサーチ株式会社)、小田 武秀 (カールツァイス株式会社)
	講演会 D FIB-SEM	3D_IMB-2_25 16:00 ~ 16:15 D会場 (4F 411/412)	「FIB-SEM による Nd-Fe-B 焼結磁石の三次元磁区コントラスト観察」 名越 正泰、有田 竜馬、佐藤 馨、中田 崇寛 (JFE テクノリサーチ株式会社)、小田 武秀 (カールツァイス株式会社)

※参加方法：ランチョンセミナー以外は会場受付 (事前申込不要)

10 (火) ~ 11 (水)	写真 コンクール	Photo-05 9:00 ~ 17:30 (11日 10:00 ~) 2F ロビー	「ダイヤモンドを夢見るカーボンの旅」 小田 武秀、孫 カイイン (カールツァイス株式会社)
-----------------	-------------	---	--